

折り返し積分を用いた ピクセルADC内蔵 擬似3次元粒子検出LSIに関する研究

〇永塩 啓、 K. P. Sengendo、 宮原正也、 松澤昭

東京工業大学大学院 理工学研究科 電子物理工学専攻 松澤·岡田研究室



2014/9/25





- ・ADC内蔵擬似3次元粒子検出LSI(QPIX)
- Charge Sensitive Amplifier(CSA)
- ・CSA用折り返し積分技術
 - 一容量型折り返し積分一電流源型折り返し積分
- ・結論と予定





- 次世代実験に向けた暗黒物質探索のための粒子検出器が求められている。粒子検出器では、粒子が発生させた電子の検出によって、その粒子の3次元情報を得る。このため、検出LSIには検出感度とダイナミックレンジの拡大が求められる。
- LSI内のCharge Sensitive Amplifier(CSA)には検出感度とダイナ ミックレンジにトレードオフ関係があったが、折り返し積分を用いる ことで解決する。
- 本発表では、2つの折り返し技術を比較する。電流源型では検出 感度10倍、ダイナミックレンジ25dBの性能向上が見込める。

	QF	Timepix	
	[1]	Target	
ダイナミックレンジ	10 fC ~ 1.5 pC	1 fC ~ 3 pC	0.1 fC ~ 12 fC
検出感度	1.6 fC	0.16 fC	-

[1]Fei Li et al., NIMPR 2011, pp.101-105

A.Nagashio, Tokyo Tech.



Pursuina Excellence

ADC内蔵擬似3次元粒子検出LSI (QPIX)

く検出プロセス>



_ 得られる情報 _____ TOT (Time Over Threshold) ⇒信号の時間幅 TOF (Time of Flight) ⇒z座標 ピクセルの位置 ⇒x-y 座標 ADC ⇒総電荷量



ΓΠΚ

3

Pursuing Excellence



Charge Sensitive Amplifier (CSA)

4

Pursuing Excellence

& Okada Lab.

ΓΠΚΥΠ



A.Nagashio, Tokyo Tech.



入力電荷量に応じてC_fを一定量放電することで 出力を飽和させることなくCSAを動作

ダイナミックレンジ拡大

容量型折り返しCSA

電流源型折り返しCSA

ΓΠΚ





5

Pursuing Excellence

容量型折り返し積分CSA

FDKYD TIECH Pursuing Excellence

6



容量型の電荷エラー



ΓΠ

& Okada Lab.

2 <u>2 00000</u>

電流源型折り返し積分CSA

入力電流に依存しないために電流源を用いる。

入力電荷が少ない (CSA output Vint < VRC) CSAはCfに電荷を蓄積



入力電荷が大きい (CSA output Vint > VRC) Cfに蓄積した電荷の一部 を電流lbで放電

折り返しフェーズ

8

Pursuina Excellence

ΓΠΚ

- ◎ Vxに感度が少なく、入力電 流にほどんど依存しない。
- ◎ 総放電電荷量

$$Q_{dis} = I_{b} \cdot t_{dis}$$

(tdis:放電合計時間)



電荷誤差の入力電流の依存性 (シミュレーション結果) 9

Pursuing Excellence

放電による電荷誤差の入力電流依存性 (容量型 vs. 電流源型)



<u>電流源型の誤差は入力電流にほとんど依存しない!!!</u>





A.Nagashio, Tokyo Tech.

(Cf = 243fC)

Matsuzawa & Okada Lab.

結論と今後



- CSAに折り返し積分を用いることで、検出感度とダイナミック レンジのトレードオフの課題を解決した。
- 電流源型CSAを用いることで、検出感度を10倍、ダイナミックレンジ25dBの性能向上が実現した。



180nmプロセスで電流源を用いた折り返し積分CSAを用いてQPIXを設計し、検出感度とダイナミックレンジの向上を実証する。



w power consumption $M_3 = H^{-1} M_4$

 Class-AB buffer for its driving ability because of large capacitor array of SAR ADC !

Charge Sensitive Amplifier (CSA)

- Consist of 2-stage operational amplifier and class-AB buffer
- Low power consumption
 Sufficient gain
 Cc for stability





12

Pursuing Excellence

Detection Sensitivity and Input Charge Range

 \star To improve the detection sensitivity

 $A_Q = -\frac{1}{C_f}$

smaller feedback capacitance



The maximum of detectable input charge becomes smaller



Trade-off between the Detection Sensitivity and Input Charge Range

A.Nagashio, Tokyo Tech.



13

Folding Integration Technique for CSA

If the input charge is large (CSA output Vint > VRC)
 the folding CSA works in folding phase

Part of the charge on Cf flows out through Cdis, and the CSA output drops below VRC

14

Pursuing Excellence

These operation repeat depending on the amount of input charge
 <u>Keeps the amplifier out of risk of saturation !!</u>



Folding Integration Technique for CSA

According to the law of conversation of charge at X point, the sum of the charge is equal before and after the folding operation

$$-V_{int}C_f + V_R C_{dis} = -V_{int,res}C_f$$

Vint,res is the residual voltage of Vint

15

ellence

After N times of discharge operation

 $-V_{int}C_f + \mathbf{N} \cdot V_R C_{dis} = -V_{int,res}C_f$



Calibration Using TOT information

The signal pulse width tpulse

$$t_{pulse} = TOT \cdot T$$

TOT : count T : clock period

The input current using tpulse

$$I_{in} = \frac{q_l}{t_{pulse}}$$

Λ.

The charge error is rewritten using tpulse

$$Q_{err} = \frac{NC_{dis}C_{c}I_{in}}{C_{f}g_{m1}} = \frac{NC_{dis}C_{c}Q_{i}}{C_{f}g_{m1}t_{pulse}}$$

Charge error can be calculated !!!



TOTによる電荷量推定の不確定性

TOKYO TIECH PursuingExcellence

& Okada Lab.

17

- 以下のすべての状況で同じ電荷量が発生していたとしても、得られる TOT情報が異なる。このため、TOTのみから推定する電荷量はすべて異なる。
- <u>従来の読み出し回路では推定される電荷量が電子雲拡散や粒子の飛行角</u> <u>度に依存し、高い精度が得られない。</u>

<u>総電荷量をピクセル内のADCで直接測定!!</u>



QPIXの動作

★読み出しフェーズ (Tofgate=Low) ⇒蓄積したデータの 読み出し

(TOT,TOF,ADC)

★電荷検出フェーズ (Tofgate=High) ⇒電荷を検出し、TOT, TOF,ADCのデータ を収集







18

DTECH PursuingExcellence

ΓΟΚ

F	Folding前誤差[fC]	Folding後誤差[fC]	誤差[fC]	誤差絶対値[fC]
)	4.560317	4.50165	-0.058667	0.058667
)	8.86E-01	8.26E-01	-0.06	0.06
5	4.41E-01	3.82E-01	-0.059	0.059
5	8.98E-02	3.21E-02	-0.0577	0.0577
•	4.80E-02	-1.12E-02	-0.0592	0.0592
•	1.34E-02	-4.58E-02	-0.0592	0.0592
;	6.68E-03	-4.99E-02	-0.05658	0.05658

パッド入力電流[A]	Folding前誤差[fC]	Folding後誤差[fC]	誤差[fC]	誤差絶対値[fC]
1.00E-09	4.560317	4.50165	-0.058667	0.058667
5.00E-09	8.86E-01	8.26E-01	-0.06	0.06
1.00E-08	4.41E-01	3.82E-01	-0.059	0.059
5.00E-08	8.98E-02	3.21E-02	-0.0577	0.0577
1.00E-07	4.80E-02	-1.12E-02	-0.0592	0.0592
5.00E-07	1.34E-02	-4.58E-02	-0.0592	0.0592
1.00E-06	6.68E-03	-4.99E-02	-0.05658	0.05658
スイッチトキャパシタ				
パッド入力電流[A]	Folding前誤差[fC]	Folding後誤差[fC]	誤差[fC]	誤差絶対値[fC]
1.00E-09	4.5603	4.6117	0.0514	0.0514
5.00E-09	8.86E-01	9.56E-01	0.0701	0.0701
1.00E-08	4.41E-01	5.37E-01	0.0951	0.0951
5.00E-08	9.23E-02	3.83E-01	0.291	0.291
1.00E-07	5.01E-02	5.89E-01	0.5386	0.5386
5.00E-07	2.56E-02	2.53E+00	2.5048	2.5048
1.00E-06	3.34E-02	5.00E+00	4.964	4.964

電流源



19

ΤΟΚΥΟΤΕΕΗ

Pursuing Excellence

QPIXとは

ΓΠΚ

& Okada Lab.

20

 QPIX(Quasi-3D Pixel Readout LSI)は総電荷量推定の精度向上を目 的とした新しい粒子検出用読み出し回路であり、すべてのピクセル内に SAR ADCを搭載し、総電荷量を直接測定する。



A.Nagashio, Tokyo Tech.

Charged particle Primary charge chamber ш LSI (anode) Pixel PAD Hitted pixel V Х 101 Ζ (Time) Induced current in pixel



電流源型FoldingのCalibration

 パッドに電荷が入って来ない状況で、Folding用の電流を一 定時間流し、その時の電荷を測定する。



- このときの電荷量をピクセルごとに測定し、データとしてあつ めておく。Foldingした回数分をそのピクセルのFolding電 荷量で補償する。
- この補償により、1回のFoldongで誤差が1LSB以下に抑えられる。



22

Pursuina Excellence

ΓΠ

結果

- カレントミラーのミスマッチ(1σ)=562.7nA
- Calによって±3σの範囲を補正。
- ・ 最大で誤差99.93%減



A.Nagashio, Tokyo Tech.



23

Pursuing Excellence

ΤΟΚΥΟ



- 新しい粒子検出LSIであるQuasi-3D Pixel Readout LSI(QPIX)では、すべてのピクセルにA/D変換器を内蔵し、高い精度の電荷量推定が可能である。
- QPIX内で用いられる従来のCSAでは、検出感度とダイナミックレンジの 間にトレードオフの関係があり、性能向上の課題であった。
- CSAに折り返し積分技術を用いることで検出感度とダイナミックレンジの 両方を向上させることができる。

	QF	Timepix	
	[1]	Target	
ダイナミックレンジ	10 fC ~ 1.5 pC	1 fC ~ 3 pC	0.1 fC ~ 12 fC
検出感度	1.6 fC	0.16 fC	-

[1]Fei Li et al., NIMPR 2011, pp.101-105



ΓΠΚ